

1. Record Nr.	UNINA9910872675503321
Titolo	1997 IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures Proceedings
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : IEEE, 1997
Descrizione fisica	1 online resource (200 pages)
Disciplina	621.3815
Soggetti	Integrated circuits - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph